# DIFFERENTIAL PROBE FOR DETECTING HIGH FREQUENCY SUPERPOSED MICROSIGNAL

Patent number:

JP7012871

Publication date:

1995-01-17

Inventor:

TAKAGI KUSUO; OKAYASU RYOICHI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

G01R19/00; G01R29/26; H04B3/46; G01R19/00;

G01R29/00; H04B3/46; (IPC1-7): G01R29/26;

G01R19/00; H04B3/46

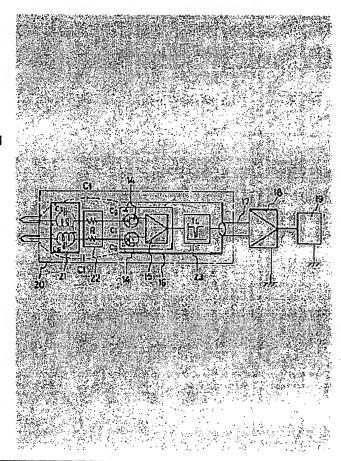
- european:

Application number: JP19930173578 19930622 Priority number(s): JP19930173578 19930622

Report a data error here

#### Abstract of JP7012871

PURPOSE:To allow easy detection of a microlevel signal using a differential probe comprising a high frequency wideband common mode choke coil, a differential voltage detecting element, and a narrow-band BPF. CONSTITUTION: When a differential probe 20 is connected with the terminal of a telephone receiver, the stray capacity Ciota is increased significantly by an attenuator 22 and a wideband common mode choke coil 21 inserted between each end of the probe 20 and the metal housing 16. Consequently, a common mode AM modulated wave VR flows from the terminal of telephone receiver to the ground on the probe 20 side. The microdifferential voltage VR detected by two FETs in an element 14 is amplified by a preamplifier 15 and only a micromodulation wave VL detected by a semiconductor circuit in a telephone set is selected by a filter 23, amplified by a main amplifier 18 and displayed on a differential output display means 19.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-12871

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	ıq	<b>计</b> 征束二体形
(SI) IIILCI.		域別配行	川川坂性併写	r i	技術表示箇所
G01R	29/26	E	8606-2G		
	19/00	K			
H 0 4 B	3/46		7406-5K		

# 審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 7 頁)

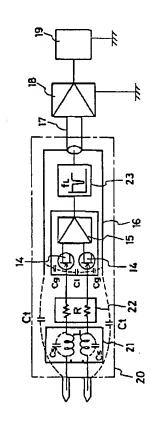
(21)出願番号	特願平5-173578	(71)出願人 000004226	
(00) (1)		日本電信電話株式会社	
(22)出願日	平成5年(1993)6月22日	東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	
		(72)発明者 髙木 国主男	
		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	日
		本電信電話株式会社内	
		(72)発明者 岡安 良一	
		東京都千代田区内幸町一丁目1番6号	Ħ
		本電信電話株式会社内	н
		(74)代理人 弁理士 角田 仁之助	

# (54) 【発明の名称】 高周波重畳微小信号検出用差動プローブ

# (57)【要約】

【目的】 AM変調された高周波が重畳した微小低周波 信号を容易に検出しうる差動プローブを提供する。

【構成】 高周波重畳微小信号検出用差動プロープを、 高周波広帯域コモンモードチョークコイル21と高周波 広帯域減衰器22と差動電圧検出素子14と所定の帯域 幅を有するパンドパスフィルタ23とにより構成する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 2端子間に生ずる微小信号を検出する差 動プローブにおいて、

該プローブの2つの接触端子に接続された高周波広帯域コモンモードチョークコイルと、該チョークコイルの出力端にそれぞれ接続された高周波広帯域減衰器と該減衰器の出力端に接続された高周波広帯域ノルマルモードチョークコイルと、該チョークコイルの出力端に接続された差動電圧検出素子と、該素子からの出力を増幅するプリアンプと所定の中心周波数を有するパンドパスフィル 10 タとからなることを特徴とする高周波重畳微小信号検出用差動プローブ。

【請求項2】 前記高周波広帯域コモンモードチョークコイルは、高周波領域まで所定の実効透磁率を有する所定の形状の閉磁路コアの長辺方向の磁路の一端から他端へ一対の入出力巻線をそろえて同方向に捲回し、前記高周波広帯域ノーマルモードチョークコイルは前記閉磁路コアの前記磁路に一対の入出力巻線を互に逆方向に捲回してなることを特徴とする請求項1記載の高周波重畳微小信号検出用差動プロープ。

【請求項3】 請求項2記載のチョークコイルの巻線は 前記閉磁路コアの長辺方向の磁路上の捲線範囲を所定の 幅で3分割し、中央は密に捲回し、両側は疎に捲回して 前記コモンモードおよびノーマルモードチョークコイル を形成してなることを特徴とする高周波重畳微小信号検 出用差動プローブ。

#### 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明はAM変調高周波信号内に 音声帯域の微小レベルの変調波信号が含まれている重量 30 信号から、微小変調波信号を分離して検出する差勤プロ ープに関するものである。

### [0002]

【従来の技術】従来、高周波や低周波の微小信号を計測するこの種の検出手段には、ハイインピーダンスプロープや差動プローブなどがある。

2

するレベルメータ、11は人が送受器を持った場合を模擬した擬似手、12は音響カプラ部分への周囲騒音の侵入を除去するしゃ音箱である。また13は受話器端子R1,R2間に生じる電圧VIを計測するための従来の差動プローブ、14は電界効果トランジスタ(以下、FETという)などの差動電圧検出素子、15はFET14やブリアンプ15を囲む差動プローブの金属管体、17は同軸ケーブルなどの差動プローブの金属管体、17は同軸ケーブルなどの差動プローブ出力ケーブル、18は差動プローブ出力ケーブル、18は差動プローブ出力ケーブル、18は差動プローブ出力ケーブル、18は差動プローブ出力ケーブル、18は手動プローブ出力ケーブル17の接続されたメインアンプ、19はオシロスコープやレベルメータなどの差動出力表示手段である。

【0004】また、図5(a)は搬送波周波数fェを変調波周波数fェで振幅変調した試験信号V。の波形、図5(b)は前記試験信号V。を通信線4に印加したときに、受話機端子Rェ,R2の間に生ずる電圧Vェの波形である。電圧VェはコモンモードのV。が電話機回路の不平衡によりノーマルモードに変換された出力で、V。と同一波形のAM変調波VェとV。が電話機の半導体回20路等で検波された変調波Vェとの重量波形となり、V」は微小レベルとなることが報告されている。(1992年電子情報通信学会、春季全国大会論文集、SB-3-2)

このような試験系を用いた電話機の雑音可聴イミュニティ特性の評価方法は、通常 V<sub>1</sub> 波形、特にその中に含まれる V<sub>1</sub> 波形のレベルが微小であるため、図中 1 3 で示した差動プローブを用いても検出困難である。そこで、一般には V<sub>1</sub> の検出のかわりに、 V<sub>1</sub> によって受話器を駆動しその音響出力をレベルメータ 1 0 に指示させ、雑音音圧 Pを測定することにより行なわれている。すなわち、印加試験信号 V<sub>0</sub> のレベルをしだいに大きくしてゆき音圧 Pがあらかじめ定められた雑音可聴音圧 P<sub>0</sub> に等しくなったときの V<sub>0</sub> の大きさで E U T の雑音可聴イミュニティ特性を評価している。

【0005】この方法は受話器の種類が何であっても最終的な雑音音圧で評価するため、すぐれた方法である。 【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前記の 測定方法では受話ロ7が電話機によりまちまちで、音響 カプラ9との嵌合性が悪く検出レベルが変動し易かった り、測定のつどしゃ音箱12内へ送受器を入れ受話ロ7 を音響カプラ9に装置する必要があるなど測定系の構成 や調整等に手間がかかる欠点がある。そこで、図に示し たようなFET差動プローブ13を直接受話器R1・R 2 端子へ接触して雑音音圧P。に相当する受話器端子間 電圧V1、特にその中の検波電圧V1を測定する電気的 な評価法が実現できればきわめて有用と考えられる。

ロ、8はコンデンサマイク、9は受話ロ7とコンデンサ 【0007】しかし、従来の差動プロープ13はFET マイク8とを音響的に結合する音響カプラ、10はコン 間の浮遊容量C1は小さいものの各FETと金属管体間 デンサマイク8の電気信号により受話器の音圧Pを指示 50 に存在する容量CgおよびCg'が大きいために、受話 器端子R1, R2にプローブを接触させたとたんに、該端子に誘起している図5(b)に示すV1中のV1と同様の誘起コモンモード電圧が容量Cg, Cg'を通って差動プローブ13の金属管体16から出力ケーブル17の外部導体を介してメインアンブ18や差動出力表示手段19等から大地に流れるので、検波電圧V1も変ってしまい、真のV1の値が変化して正しい雑音可聴音圧P0に対応したV1の値が計測できないという問題点があった。

【0008】本発明は前記の問題点を解決するため、従 10 来の差動プローブの入力部に、高周波のコモンモード電流に対してハイインピーダンスとなる手段を設けると共にプローブ内に検波電圧 V<sub>L</sub> を選択する手段を設け微小レベルの信号の検出ができるようにすることを目的とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は前記の課題を解決するために、2端子間に生ずる高周波重量低周波微小信号を検出する差動プロープを、2つの接触端子に接続されるペア線を所定の実効透磁率を有する閉磁路コアに 20分割巻きしてなるコモンモード高周波広帯域チョークコイルと該チョークコイルの出力を高周波減衰器を介して接続する差動電圧検出素子と、該素子の出力を増幅する増幅器と該増幅器の出力に接続された前記低周波信号周波数を中心周波数とする狭帯域バンドパスフィルタとにより構成する。

#### [0010]

【作用】本発明によれば前記のように構成したので差動信号出力端子に出力される検波信号に重畳して出力される高周波成分に対してはコモンモード高周波広帯域チョ 30 ークコイルが高インピーダンスを呈するので前記端子に差動プローブを接触させても試験回路に攪乱を与えることはなく、また差動電圧検出素子が検出した差動信号を増幅する増幅器のあとに接続した狭帯域パンドパスフィルタによって増幅系の信号対雑音比が大幅に改善されるので微小低周波信号を容易に検出できるのである。

#### [0011]

【実施例】図1は本発明の第1の実施例のプロック図である。

【0012】図1において、20は本発明の差動プロー 40 ブ、21はプローブ先端回路部に用いた入出力巻線間容量C、が小さく、インダクタンスの大きい高周波広帯域コモンモードチョークコイル、22は高周波領域まで減衰特性が一定の広帯域減衰器、23は変調波周波数fiを通過中心周波数とする狭帯域パンドパスフィルタである。なお、14はFETなどからなる差動電圧検出素子、15はプリアンプ、16は差動プローブの金属筐体、17は同軸ケーブルなどの差動プローブ出力ケーブル、18はメインアンプ、19はオシロスコープ或はレベルメータなどの差動出力表示手段である。このような50

構成の差動プローブ20の先端を受話器R1・R2 端子に接触した場合、プローブの各先端とその金属筐体16との間には広帯域コモンモードチョークコイル21と、アッテネータ22とが挿入されているため浮遊容量C1がきわめて小さく、差動電圧検出素子14のFET入力部と金属筐体16との間に大きな浮遊容量Cg, Cg′があっても、受話器R1, R2端子に生じているコモンモードのVIがプローブ側から大地に流れることはない。したがって、差動電圧検出素子14の2つのFETで検出した微小差動電圧VIは、プリアンプ15で増幅され、フィルタ23によってVI成分のみが選択された後ナインアンプ18で増幅され差動出力表示手段19で表示される。

【0013】 ここで図3は図1のパンドパスフィルタ23を除去した場合の $V_{\text{I}}$ のスペトクラムを示したもので図3(a)はプリアンプ15の出力部、図3(b)はメインアンプ18の出力部のスペクトラムである。雑音可聴音圧 $P_0$ を与える $V_{\text{I}}$ 中の $V_{\text{I}}$ や $V_{\text{L}}$ 、特に $V_{\text{L}}$ は前述したように微小レベルであり、これがプリアンプ15で増幅された後も通常は図3(a)の $V_{\text{I}}$ で示される計測器の検知限界レベル以下である。したがって図3(a)のレベルを更に増幅する必要があり、これをそのまま増幅度Aのメインアンプ18を通すと、図3(b)に示されるように $V_{\text{L}}$ および $V_{\text{I}}$ のレベルはそれぞれA $V_{\text{L}}$ およびA $V_{\text{E}}$ となって検知限界レベル $V_{\text{S}}$ 以上となる。

【0014】しかし、これらはもともと、メインアンプ18への入力レベルが小さく、他のノイズ成分を含むため、これらの増幅分にメインアンプ18自身の持つホワイトノイズの増幅分が加わった出力レベルV。以下となり、レベルV。の中に埋もれた状態になっている。

【0015】このような状態でオシロスコープ等の差動出力表示手段19に出力信号をそのまま入力しても $V_L$ や $V_B$ の検知は困難であり、検知可能とするためには $f_L$ や $f_B$ のみに同調させた選択レベルメータやスペクラムアナライザなど周波数選別機能をもつ大規模で高価な計測器が必要となるなどの欠点がある。また、これらの計測器を用いた場合にも、同調周波数の帯域幅等によっては変調周波数 $f_L$ や搬送周波数 $f_B$ の検知分解能が不十分となるという欠点がある。

【0016】これに対して本発明では、図1に示したようにプリアンプ15の出力をバンドバスフィルタ23を通した後メインアンプ18に入力している。図2(a)はこのときのバンドバスフィルタ23の出力部、図2(b)はメインアンプ18の出力部のスペクトラムであり、図3(a)のようにノイズ成分を含むプリアンプ15の出力からバンドバスフィルタ23を通して図2(a)のようにVi成分のみを抽出し、これをメインアンプ15で増幅して図2(b)のようなAViレベルを得ており、これを差動出力表示手段19で表示すれば、

選択レベルメータやスペクトラムアナライザなどの大規 模な計測器がなくてもViを容易に検知することができ る。

【0017】図6は本発明の差動プロープ20の先端に 用いる高周波広帯域コモンモードチョークコイル21の 構成を示す第1の実施例であり、24は高周波領域まで 所定の透磁率を有する方形状の閉磁路コア、25は中央 磁路の11部分に疎に捲回した巻線、26は中央磁路の 1。部分に密に捲回した巻線、27は中央磁路の12部 分に疎に捲回した巻線であり、いずれの巻線も2本そろ 10 えてあるいはそろえた上に撚り線にして各磁路に捲回し てある。また密に捲回した磁路1。部分は他の疎に捲回 した11, 12 部分にくらべ長さが短くなっている。こ のようなチョークコイルでは各巻線25,26,27の 両端間に浮遊容量それぞれC1, C0, C2 が散在し、 密巻線26を施した磁路1。部分のC。は大きな値をも つが疎巻線を施した1.1.部分は磁路が長く巻線ビ ッチも大きいためC1, C2 は小さい。したがって、こ れらが直列接続されるチョークコイル21全体の入出力 れる。したがって、差動プロープ20の入力端子から高 周波のコモンモード電流が侵入しても上記入出力巻線間 容量部分の影響が少なく、高周波域での阻止特性の低下 は少ない。また、コアの一部に集中巻線26が施されて いるため、低域でのインダクタンスが大きくなり、これ によって阻止特性が低域側にも拡大し全体として広帯域 特性が実現できる。また受話器端子間電圧V』の計測時 のようなプロープ入力端子間のノーマルモード電流に対 しては2つの線がそろえて、またはそろえた上に撚り線 にしてコアに捲回されているため線間の漏洩インダクタ 30 ンスが小さく、伝送損失は小さくなる。

【0018】図7は本発明による差動プロープ20の先 端に用いるコモンモードチョークコイル21の構造を示 す第2の実施例、図8は同第3の実施例であり、いずれ も図6の集中巻線26部分に第2のコア(補助コア)2 8または28′をあてて、両閉磁路の中央磁路に共通の 集中巻線26を施したものである。このような構造では コモンモード電流に対して補助コア28または28′に もインダクタンスが生じるため低域での阻止特性を改善 できる効果がある。なお図8のコア29は図6や図7の 40 方形状コア24にかえて中央の対向磁路間距離が大きい 菱形コアとしたもので、図示しない楕円形状としても同 様であるが、集中巻線26部分の中央・外部磁路間距離 が拡大されるため巻数を増加させることができ、それだ け低域での阻止特性を更に改善できる利点がある。

【0019】図9は図6のコモンモードチョークコイル 21の方形状コア24のかわりに部分同軸円筒状のコア を用いた実施例であり30-1および30-2は円軸状 外部磁路に切欠きのあるコアを長さ方向の中央部で半分 に切断した構成のものであり、あらかじめ中央磁路を挿 50 れ、このスイッチSWュ, SWュ を短絡側に切替えれ

入する円筒状ポピン31に前述のような巻線25~27

を施し、両側からコア30-1,30-2を挿入して固 定するようにしてある。

【0020】以上、高周波のコモンモード電流に対して は、図6~図9のようなチョークコイルが有効であるこ とを述べたが図1に示すように、これらと広帯域アッテ ネータ22を組合せた構成にすれば更に前記Cgが小さ くなり阻止特性が改善できることは明らかである。なお これまでの説明ではいずれのコアに対しても巻線は図6 の25~27のような密および疎な巻線で構成するよう 説明したが要求される特性によっては疎密の区分をせず 均質に捲回しても本発明の効果がそこなわれないことは 明らかである。

【0021】図10は図4の試験系で、受話器端子Ri ・R<sub>2</sub> に、図4の従来の差動プローブ13および本発明 の第1の実施例である図1の差動プロープ20を接触し た前後について、雑音音圧Pの変動量を求めた一例であ り図10のIは従来プロープ使用時、IIは本発明による 差動プローブ使用時の特性である。図10に示すように 巻線間容量は一部に大きなC。があっても小さく抑えら 20 従来プローブ接触時には音圧変動が30dB以上あった ものが本発明のプローブの場合には、3dB程度に抑え られており、これによって本発明の改善効果が明らかで ある。

> 【0022】図11は本発明の差動プロープの第2の実 施例であり、32はノーマルモード電流に対して大きな インダクタンスをもちコモンモード電流に対してはイン ダクタンスが小さいノーマルモードチョークコイルであ

【0023】図12は図11のコモンモードチョークコ イル21とノーマルモードチョーク32の構造比較説明 図であって図に示すようにノーマルモードチョークコイ ル32は、図6に示す閉磁路コア24と同じ形状のコア 24'に巻線25', 26', 27"を捲回したもの で、その捲線位置はコモンモードチョークコイル21の 巻線25,26,27と同一磁路上に捲回され、2つの 巻線方向が互に逆巻きにしてある。

【0024】図11に示すように差動電圧検出素子14 の入力側に前記のノーマルモードチョークコイル32を 挿入すると2つのFETの入力線間容量Clが大きい場 合にはプロープ入力端子間に生じる高周波のV』信号が Clで短絡され、正しいレベルが計測できないことがあ るが、このような場合、ノーマルモードチョークコイル 32は、Va によるノーマルモード電流に対しては大き いインダクタンスとして作用するため、正しいV』を計 測することができる。

【0025】次に図11のSW1, SW2 はパンドパス フィルタ23を入り切りするスイッチである。スイッチ SW1, SW2 をパンドパスフィルタ側に切替えれば、 図1の出力と同様のV. の波形とレベルの信号が出力さ 7

ば、 $V_{\text{I}}$  と $V_{\text{I}}$  の重畳された波形とレベルの信号が出力され、レベルの大きい $V_{\text{I}}$  のレベルを検知できる。すなわち、本スイッチ $SW_{\text{I}}$  , $SW_{\text{I}}$  の切替えにより、 $V_{\text{I}}$  または $V_{\text{I}}$  の波形と出力レベルを区別して検知することができる。

【0026】図13は本発明による差動プロープの第3の実施例のプロック図である。同図において33は通過中心周波数が $f_{\text{R}}$ の高周波用のパントパスフィルタであり、プリアンプ15の出力を2系統に分けそれぞれ低周波用パンドパスフィルタ23、及び高周波用パンドパス 10フィルタ33を通して出力するようにし、メインアンプも18-1,18-2それぞれの帯域用を用いたもので、これによって2チャンネルの表示手段19を用いれば $V_{\text{L}}$ と $V_{\text{R}}$ り両波形およびレベルを区別して同時に検知できる。

【0027】図14は本発明の第4の実施例で、図13 に示す第3の実施例の差動プローブの低周波用狭帯域バ ンドパスフィルタ23′及び高周波用狭帯域パンドパス フィルタ33′は各通過中心周波数 f L , f x を外部制 御電圧で変化できるようにしたもので、制御端子34-20 1および34-2を設けてある。これらの端子へ可変直 流電圧など外部信号を印加することにより、それぞれの 中心通過周波数を変えることができるようにしてあり、 雑音可聴イミュニティ試験で、AM変調波の印加信号の うち、fuやfuの内、少くとも一方の周波数を変えて 行う場合、これらに同期させた外部信号を各制御端子3 4-1または34-2に印加することにより、差動プロ ープの入力信号周波数に同期して各フィルタの通過周波 数が選択されるため、目的とする計測電圧が正しく検知 される。よって、印加信号を掃引させた前記イミュニテ 30 ィ試験を自動化することも可能となる。

### [0028]

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明は、AM変調高周波信号内に音声帯域の微小変調波が含まれた重畳信号から、微小変調波信号を分離して検出する差動プローブの2つの接触端子と差動電圧検出素子との間にコイルの巻線数を増加しても、入出力巻線間の浮遊容量が小さく、線間の漏洩インダクタンスも小さい高周波広帯域コモンモードチョークコイルを挿入するとともに、ブリアンプの出力に微小変調周波のみを通過させる40狭帯域パンドパスフィルタを接続し、所要レベル迄増幅するようにしたので、差動プローブを被試験機の受話器端子に接触させても、雑音音圧など負荷系への影響が殆どなく、適正な微小変調波レベルを検出することができるという顕著な効果がある。

【0029】なお、差動プローブの差動電圧検出素子に用いる2つのFETなどの素子間の入力インピーダンスが小さい場合でも、測定点へのプローブ接触により検出電圧が低下しないので適正な計測が行えるという効果も期待できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例のブロック図である。

【図2】本発明の差動ブローブを用いたときの検出信号 のスペクトラムの一例の説明図である。

8

【図3】従来の差動プローブによる検出信号と搬送周波数のスペクトラムの一例の説明図である。

【図4】雑音可聴イミュニティ特性を評価する試験系の説明図である。

【図5】(a)試験信号とし用いる振幅V。のAM変調波の波形図である。

(b) 試験信号V。を通信線に印加した時に被試験機の 受話器端子R<sub>1</sub>・R<sub>2</sub>間に生ずる電圧V<sub>1</sub>の波形図であ

【図 6】本発明の差動プロープ入力部に挿入する方形状コアを用いた高周波広帯域コモンモードチョークコイルの構造説明図である。

【図7】本発明の差動プロープ入力部に挿入する方形状コアと方形状補助コアを用いた高周波広帯域コモンモードチョークコイルの構造説明図である。

7 【図8】本発明の差動プロープ入力部に挿入する菱形状 コアと方形状補助コアを用いた高周波広帯域コモンモー ドチョークコイルの構造説明図である。

【図9】本発明の差動プロープ入力部に挿入する部分同 軸円筒状コアを用いた高周波広帯域コモンモードチョー クコイルの分解構造説明図である。

【図10】図10の試験系の受話器端子間に差動プローブ接触時の雑音音圧の変動を示す図である。

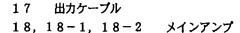
【図11】本発明の第2の実施例のプロック図である。

【図12】本発明の差動プローブに挿入するコモンモードとノーマルモードの高周波広帯域のチョークコイルの 構造比較説明図である。

【図13】本発明の第3の実施例のプロック図である。

【図14】本発明の第4の実施例のプロック図である。 【符号の説明】

- 1 被試験機器(EUT)
- 2 擬似大地面
- 3 絶縁支持台
- 4 EUTの通信線
- 5 送受器コード
- 0 6 送受器
  - 7 受話口
  - 8 コンデンサマイク
  - 9 音響カプラ
  - 10 レベルメータ
  - 11 擬似手
  - 12 遮音箱
  - 13 従来の差動プロープ
  - 14 差數電圧検出素子
  - 15 プリアンプ
- 50 16 金属筐体



19 差動出力表示手段

 $R_1$  ,  $R_2$ 受話器端子

f B 搬送波周波数

f٤ 変調波周波数

20 本発明の差動プローブ

2 1 コモンモードチョークコイル

高周波広帯域減衰器 22

23 低周波狭帯域フィルタ

23′ 中心周波数可変狭帯域フィルタ

24,24′ 方形状コア

24, 25' 巻線

26, 26' 巻線

27, 27' 巻線

28, 28' 方形状補助コア

29 菱形状コア

部分同軸円筒状コア 30

3 1 巻枠

3 2 ノーマルモードチョークコイル

33 広帯域パンドパスフィルタ

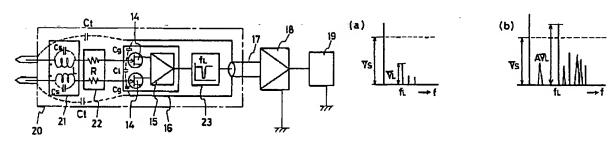
10 33' 中心周波数可変パンドパスフィルタ

> 34-1, 34-2制御端子

【図1】

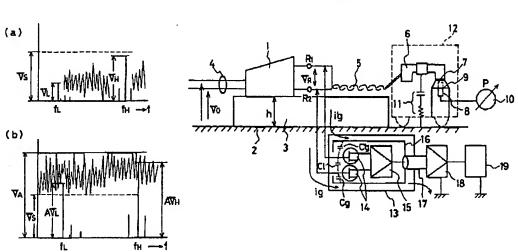
【図2】

10

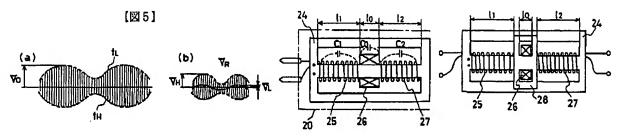


[図3]

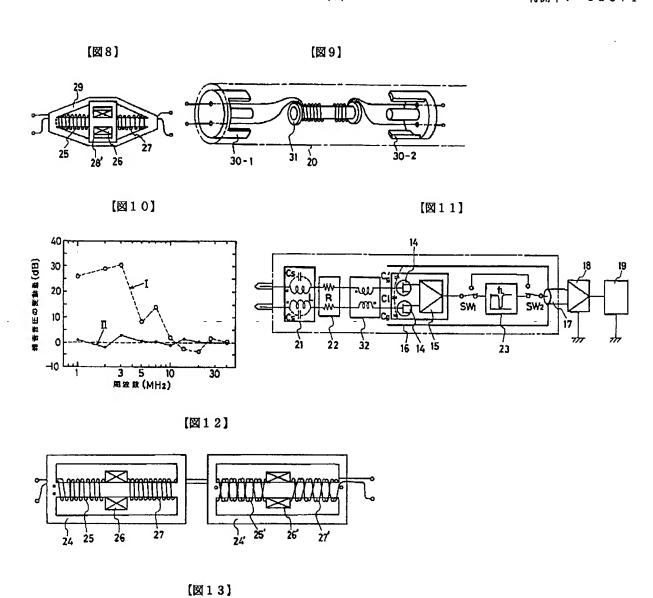
[図4]

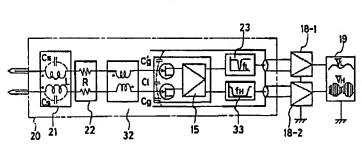


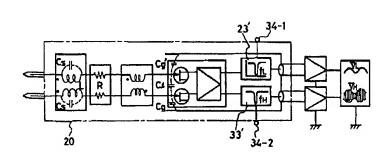
[図7]



【図6】







【図14】